

تماس تلفنی جهت دریافت مشاوره:

۱. مشاور دفتر تهران (آقای محسن ممیز)

تلفن: ۰۹۱۲ ۹۶۳ ۹۳۳۶

۲. مشاور دفتر اصفهان (سرکار خانم لیلاممیز)

تلفن: ۰۹۱۳ ۳۲۲ ۸۲۵۹



مجموعه سیستم مدیریت ایزو با هدف بهبود مستمر عملکرد خود و افزایش رضایت مشتریان سعی بر آن داشته، کلیه استانداردهای ملی و بین المللی را در فضای مجازی نشر داده و اطلاع رسانی کند، که تمام مردم ایران از حقوق اولیه شهروندی خود آگاهی لازم را کسب نمایند و از طرف دیگر کلیه مراکز و کارخانه جات بتوانند به راحتی به استانداردهای مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

این موسسه اعلام می دارد در کلیه گرایشهای سیستم های بین المللی ISO پیشگام بوده و کلیه مشاوره های ایزو به صورت رایگان و صدور گواهینامه ها تحت اعتبارات بین المللی سازمان جهانی IAF و تامین صلاحیت ایران می باشد.

هم اکنون سیستم خود را با معیارهای جهانی سازگار کنید...





جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

19954

1st Edition

2019

Identical with
ASTM E666:

2014



استاندارد ملی ایران

۱۹۹۵۴

چاپ اول

۱۳۹۸

محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس—
آینکار

**Calculating absorbed dose from gamma or X
radiation— Standard practice**

ICS: 17.240

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس—آینکار»

سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای- پژوهشکده کاربرد پرتوها

حاجیلو، ناهید

(دکتری فیزیک هسته‌ای)

دبیر:

شرکت توسعه کاربرد پرتوها

بهشتی، زهرا سادات

(کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت پارس ایزوتوپ

اربابی، کوروش

(کارشناسی ارشد فیریک پزشکی)

پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی

اردانه، مرتضی

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
درمانی تهران

جزایری قره‌باغ، الهه

(دکتری فیزیک پزشکی)

پژوهشکده سیستم‌های پیشرفته صنعتی

سمیع‌پور، فرهاد

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای- پژوهشکده کاربرد پرتوها

سیحون، مرضیه

(کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تهران

شیخزاده، پیمان

(دکتری فیزیک پزشکی)

مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور

طاهری، مهران

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

سازمان انرژی اتمی ایران

عسکری، محمد علی

(دکتری فیزیک پزشکی)

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای- پژوهشکده کاربرد پرتوها

عطائی‌نیا، وحیده

(کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تهران

نیکوگفتار مفرد، آزاده

(کارشناسی ارشد فیریک هستدای)

سمت و/یا محل اشتغال:

ویراستار:

سازمان ملی استاندارد ایران- مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و

صبور گیلوان، عباس

مقیاس‌ها

(کارشناسی مهندسی مکانیک- ساخت و تولید)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۲	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۳	۴ اهمیت و کاربرد
۴	۵ محاسبه دُز جذبی
۵	۶ تخمین دُز جذبی در یک ماده از دُز جذبی اندازه‌گیری شده در ماده دیگر
۷	۷ درستی
۸	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) عمق تعادل ذره باردار
۱۰	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) نمونه محاسبه دُز جذبی برای طیف گسترده انرژی فوتون
۱۶	پیوست پ (آگاهی‌دهنده) نمونه محاسبه دُز جذبی برای طیف انرژی فوتون تقریباً تک انرژی
۱۷	پیوست ت (آگاهی‌دهنده) تضعیف باریکه
۱۹	پیوست ث (آگاهی‌دهنده) توجیه تجربی معادله (۳)
۲۱	پیوست ج (آگاهی‌دهنده) محاسبه دُز
۲۲	کتابنامه

پیش‌گفتار

استاندارد «محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس – آینکار» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در چهارصد و ششمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مذبور است:

ASTM E666: 2014, Standard Practice for Calculating Absorbed Dose From Gamma or X Radiation.

محاسبه دُز جذبی ناشی از پرتو گاما یا ایکس-آیین کار

هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن و همچنین در نظر گرفتن محدودیتهای قانونی، برعهده کاربر این استاندارد است.

۱ هدف و دامنه کاربرد^۱

۱-۱ هدف از تدوین این استاندارد، ارائه تکنیکی برای محاسبه دُز جذبی در ماده با آگاهی از میدان پرتو، ترکیب ماده (به منابع [۱] تا [۵] کتابنامه مراجعه شود)^۲ و اندازه‌گیری‌های مربوطه است. این استاندارد برای پرتو گاما و ایکس تولیدشده با فوتون‌هایی با انرژی در گستره 10^{-4} تا 20 MeV کاربرد دارد.

۲-۱ این استاندارد، روشی را برای محاسبه دُز جذبی در ماده با دانستن دُز جذبی در ماده دیگری که در همان میدان پرتوی در معرض پرتو قرار گرفته است، ارائه می‌دهد. این روش اجرایی به مواد همگن ترکیب شده از عناصری که ضرایب جذب آنها در جداول مربوط مشخص شده است، محدود می‌شود. این جداول برای تمام ۹۲ عنصر طبیعی در منبع [۲] کتابنامه ارائه شده است. همچنین به برخی از اطلاعات طیف انرژی میدان پرتوی تولیدشده به وسیله چشمی تحت ملاحظات مربوطه، لازم است. به‌طور کلی درستی این روش محدود به درستی اطلاعات طیف انرژی میدان پرتوی است.

۳-۱ نتایج این استاندارد فقط در صورتی صحت دارد که در عمق موردنظر از ماده، تعادل ذره باردار برقرار باشد. بنابراین، این استاندارد برای تعیین دُز جذبی در مجاورت مرزهای بین مواد با اختلاف عدد اتمی زیاد کاربرد ندارد. برای اطلاعات بیشتر در این مورد، به استاندارد ASTM E1249 مراجعه شود.

۴-۱ کدهای کامپیوتری انتقال انرژی وجود دارند که برای محاسبه دقیق‌تر دُز جذبی در مواد، نسبت به این استاندارد، به کار می‌روند. استفاده از این کدها، نیازمند صرف تلاش، زمان و هزینه بیشتری است. در شرایط مناسب، به جای روشی که در این استاندارد توضیح داده شده است بهتر است از چنین محاسباتی استفاده شود.

۱- توضیحات تکمیلی در خصوص دامنه کاربرد این استاندارد، در بند اهمیت و کاربرد (به بند ۴ مراجعه شود) ارائه شده است.
۲- همچنین به مدرک 80 ICRU مراجعه شود. محاسبه دُز جذبی در سیستم‌های دُزسنجی و مواد مورد استفاده در پرتوفرآوری، ضرایب تضعیف جرمی و ضرایب جذب انرژی جرمی برای عناصر کلیدی، ترکیبات و مواد مورد استفاده در دُزسنجی پرتوفرآوری با فوتون‌هایی با انرژی در گستره 10^{-4} تا 20 keV، در پیوست ۱ مدرک 80 ICRU ارائه شده است.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابط وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است.
بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

- 2-1 ASTM E170, Terminology Relating to Radiation Measurements and Dosimetry
- 2-2 ASTM E668, Practice for Application of Thermoluminescence-Dosimetry (TLD) Systems for Determining Absorbed Dose in Radiation-Hardness Testing of Electronic Devices
- 2-3 ASTM E1249, Practice for Minimizing Dosimetry Errors in Radiation Hardness Testing of Silicon Electronic Devices Using Co-60 Sources
- 2-4 ICRU Report 18, Specification of High Activity Gamma-Ray Sources
- 2-5 ICRU Report 21, Radiation Dosimetry: Electrons with Initial Energies Between 1 and 50 MeV
- 2-6 ICRU Report 34, The Dosimetry of Pulsed Radiation
- 2-7 ICRU Report 51, Radiation Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry
- 2-8 ICRU Report 60, Radiation Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation
- 2-9 ICRU Report 80, Dosimetry Systems for Use in Radiation Processing

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف ذکر شده در زیر به کار می‌روند:

۱-۳

طیف شارش انرژی

$\psi(E)$

energy fluence spectrum

حاصل‌ضرب طیف شارش ذره (به استاندارد ASTM E170 مراجعه شود) در انرژی ذره. در این استاندارد، «ذرات» به فوتون‌ها اشاره دارد. طیف شارش انرژی همان شارش انرژی بر واحد انرژی است.

۲-۳

energy fluence

انتگرال طیف شارش انرژی روی تمام گستره انرژی‌های موجود ذره است.

۳-۳

عمر جرمی و ضخامت جرمی
 t

mass-depth and mass-thickness

حاصل ضرب طول مسیر طی شده درون یک ماده در چگالی جرمی ماده. عمق جرمی و ضخامت جرمی، بُعد جرم بر واحد سطح دارد.

۴ اهمیت و کاربرد

۱-۴ برای بیان اثرات پرتو بر مواد، دُز جذبی نسبت به پرتوگیری^۱ پارامتر معنی‌دارتری است. دُز جذبی، انرژی جذب شده در واحد جرم ماده پرتودهی شده است درحالی که پرتوگیری، مقدار بار تولیدشده در واحد جرم هوا است. دُز جذبی، بر انجام اندازه‌گیری در شرایط تعادل ذره باردار (الکترون) دلالت دارد (به پیوست الف مراجعه شود). در عمل، دستیابی به چنین شرایطی به سختی امکان‌پذیر است اما در برخی موارد، به صورت تقریبی می‌توان به این شرایط نزدیک شد.

۲-۴ مواد مختلف، هنگامی که در میدان پرتوی یکسان در معرض پرتو قرار می‌گیرند، مقدار متفاوتی از انرژی را جذب می‌کنند. برای استفاده از تکنیک‌های این استاندارد، برای بیان دُز جذبی در یک ماده نسبت به دُز جذبی در ماده دیگر، باید تعادل ذره باردار وجود داشته باشد. همچنین اگر پرتو به وسیله ضخامت معنی‌داری از یک جاذب تضعیف شود، طیف انرژی پرتو تغییر خواهد کرد که این موضوع لازم است تصحیح شود.

یادآوری - برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش‌های دُزسنجی متنوع کاربردی برای انواع پرتوها و انرژی‌ها و گستره‌های آهنگ دُز جذبی تشریح شده در این روش، به مدرک‌های ICRU 34 و نیز ICRU 80 مراجعه شود.

۵ محاسبه دُز جذبی

۱-۵ دُز جذبی، D ، در یک نقطه می‌تواند به صورت زیر بیان شود:

$$D = I \int_0^{\infty} \psi(E) [\mu_{\text{en}}(E)/\rho] dE \quad (1)$$

که در آن:

شارش انرژی بر واحد انرژی در نقطه مورد نظر؛ $\psi(E)$

ضریب جذب انرژی جرمی؛ و $\mu_{\text{en}}(E)/\rho$

فاکتور بهنجارش است. I

اگر تمام متغیرها در معادله (1) در دستگاه بین‌المللی یکایها (SI) بیان شوند، I برابر ۱ خواهد بود. یکای دُز جذبی ($J \cdot kg^{-1}$)، یکای $\psi(E)$ ، Gy ، $m^2 \cdot kg^{-1}$ و $\mu_{\text{en}}(E)/\rho$ ، J است. برای مقادیر جایگزین I به پیوست ب مراجعه شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از ضرایب جذب انرژی برای محاسبه دُز جذبی به منبع [1] کتاب‌نامه مراجعه شود. طیف شارش انرژی، $(E)\psi$ ، ورودی در نقطه‌ای است که دُز در آن باید تعیین شود. در عمل، حدود انتگرال همان حدود انرژی است که در آن، $(E)\psi$ بزرگی معنی‌داری دارد. اگر ماده‌ای حائل در بین چشم و نقطه‌ای که دُز در آن به دست می‌آید، باشد، طیف مورد استفاده در محاسبات باید طیف خروجی چشمی تغییر یافته با اثرات جذب ماده حائل باشد. مقادیر $\mu_{\text{en}}(E)/\rho$ در حداول منبع [2] کتاب‌نامه آورده شده‌اند.

یادآوری - برای اصطلاحات، تعاریف و یکاهای به کار رفته در گزارش داده‌ها، می‌توان از استاندارد ASTM E170 و نیز مدارک 51 ICRU و 60 ICRU به عنوان راهنمای استفاده کرد.

۲-۵ اگر ماده‌ای که دُز جذبی در آن محاسبه می‌شود ترکیبی همگن از موادی باشد که در فهرست جدول ارائه شده در منبع [2] کتاب‌نامه وجود نداشته باشد، $\mu_{\text{en}}(E)/\rho$ به روش زیر به دست می‌آید:

۱-۲-۵ از منبع [2] کتاب‌نامه مقادیر $\mu_{\text{en}}^i(E)/\rho$ را برای هریک از اجزای i به دست آورید.

۲-۲-۵ سهم جرمی، w_i ، هریک از اجزاء را به دست آورید.

۳-۲-۵ $\mu_{\text{en}}(E)/\rho$ را از معادله زیر محاسبه کنید:

$$\mu_{\text{en}}(E)/\rho = \sum_i w_i [\mu_{\text{en}}^i(E)/\rho] \quad (2)$$

۴-۲-۵ مقادیر $\rho/\mu_{en}(E)$ باید برای هر مقدار انرژی فوتون، E ، که در آن $(E)\psi$ معنی دار است، به دست آید.

۳-۵ انتگرال در معادله (۱) به صورت عددی محاسبه می شود. مقادیر $\rho/\mu_{en}(E)$ در منبع [۲] کتاب نامه برای انرژی های خاصی ارائه شده اند. در ارزیابی انتگرال مربوط به عملیات واقعی، به طور معمول بازه های انرژی مورد نظر با مقادیر ارائه شده در منبع [۲] کتاب نامه مطابقت ندارند. در این موارد، مقدار مناسب $\rho/\mu_{en}(E)$ برای انرژی های انتخاب شده باید طی روش درون یابی قابل قبول به دست آیند. گستره انرژی روی طیف کلی فوتون به بازه های انرژی کوچک تر تقسیم می شود. پهنه ای این بازه ها تقریباً انعطاف پذیر است اما باید به اندازه های کوچک باشد که شکل طیف تغییر نکند. به منظور انتخاب مقادیر مناسب $\rho/\mu_{en}(E)$ ، مقدار انرژی انتخاب شده برای هر بازه انرژی می تواند انرژی نقطه شروع یا نقطه وسط هر بازه انرژی برای کل طیف باشد.

۴-۵ طیف شارش انرژی، $(E)\psi$ ، به طور رایج بر حسب یکاهای دلخواه داده می شود و می تواند به برخی پارامترهای چشممه به نجار شود. در صورت استفاده از دُز سنج استاندارد یا کالیبره شده، انتگرال معادله (۱) باید برای ماده سازنده دُز سنج محاسبه شود. مقدار I با تقسیم دُز جذبی، D ، اندازه گیری شده به وسیله دُز سنج بر مقدار بازه، به دست می آید.

۶ تخمین دُز جذبی در یک ماده از دُز جذبی اندازه گیری شده در ماده دیگر

۱-۶ اگر دُز جذبی در یک ماده A ، مشخص باشد، دُز جذبی در ماده دیگر B ، با استفاده از روش توضیح داده شده در این بند می تواند تخمین زده شود.

۱-۱-۶ دُز جذبی مشاهده شده در A در عمقی از ماده A اتفاق می افتاد، به طور مشابه اطلاع از دُز جذبی در B در عمق مشخصی از ماده B مورد نظر است. اگر فرض شود که طیف شارش انرژی سطح، $(E)\psi_0$ ، (طیف شارش انرژی ورودی روی سطح ماده A و B) شناخته شده باشد، طیف شارش انرژی، $(E)\psi$ مورد استفاده در معادله (۱) باید به طیف شارش انرژی سطح $(E)\psi_0$ نسبت داده شود. یک تقریب خوب برای طیف شارش انرژی تضعیف شده در عمق جرمی t به صورت زیر به دست می آید:

$$\Psi_t(E) = \Psi_0(E) \exp\left(-\left[\frac{\mu_{en}(E)}{\rho}\right] t\right) \quad (3)$$

که در آن:

عمر جرمی ماده (بر حسب $\text{kg} \cdot \text{m}^{-2}$) بین سطح و عمق موردنظر؛ t

انرژی مشخصی در طیف؛ E

شارش انرژی به ازای واحد انرژی در عمق جرمی t است. $\Psi_t(E)$

برای نحوه استنتاج معادله (۳) به پیوست ت مراجعه شود. همچنین به زیربندهای ۳-۱-۶ و ۴-۱-۶ مراجعه شود. برای نشان دادن امکان پذیر بودن معادله (۳) از نظر تجربی به پیوست ث مراجعه شود.

۲-۱-۶ با استفاده از معادله های (۱) و (۳)، ارتباط بین دُز معلوم D_A و دُز مورد نظر D_B می تواند به صورت زیر بیان شود:

$$\frac{D_A}{D_B} = \frac{\int_0^{\infty} \left[\Psi_0(E) \exp\left(-\left[\frac{\mu_{\text{en}}^A(E)}{\rho_A}\right] t_A\right) \right] \left[\frac{\mu_{\text{en}}^A(E)}{\rho_A}\right] dE}{\int_0^{\infty} \left[\Psi_0(E) \exp\left(-\left[\frac{\mu_{\text{en}}^B(E)}{\rho_B}\right] t_B\right) \right] \left[\frac{\mu_{\text{en}}^B(E)}{\rho_B}\right] dE} \quad (4)$$

که μ_{en}^A و ρ_A به ترتیب ضریب جذب انرژی، چگالی و عمق جرمی مربوط به نقطه A هستند و ماده B نیز به طور مشابه نامگذاری می شود. برای جزئیات بیشتر در مورد چگونگی استنتاج معادله (۴)، به پیوست ج مراجعه شود. تمام متغیرها در معادله (۴) به استثنای مقدار مورد نظر D_B ، معلوم فرض می شوند. انتگرال معادله (۴) باید به صورت عددی حل شود.

۳-۱-۶ استفاده از معادله (۳) منوط به وجود تعادل ذره باردار است (برای توضیح بیشتر به زیربند ۱-۳ مراجعه شود). به طور منطقی این شرایط در ناحیه ای می تواند اتفاق بیافتد که به اندازه کافی از مرزهایی که در آن تغییر در عدد اتمی یا چگالی ماده وجود دارد، فاصله داشته باشد (به پیوست الف مراجعه شود).

۴-۱-۶ تقریب باریکه پهن در مقایسه با باریکه باریک

۶-۱-۴ استفاده از ضریب انرژی μ_{en} در معادله (۳) براساس این فرض است که پرتو به شرایط «باریکه پهن» تمایل پیدا کند که مخالف با شرایط باریکه باریک است. شرایط «باریکه پهن» و «باریکه باریک» بیانگر حالت های محدودی است که تقریباً برای تجربه واقعی در نظر گرفته می شود. در مورد باریکه باریک، فرض می شود فوتون هایی که از باریکه به بیرون پراکنده می شوند، از باریکه حذف شده و پس از آن در عمل اهمیتی ندارند. در مورد باریکه گستردگی، فرض می شود فوتون هایی که از ناحیه کوچکی از باریکه گستردگی به بیرون پراکنده می شوند، با فوتون های پراکنده شده از نواحی مجاور در باریکه جایگزین می شوند. در مورد باریکه باریک معادله (۳) می تواند به صورت زیر بیان شود:

$$\Psi_t(E) = \Psi_0(E) \exp\left(-\left[\frac{\mu(E)}{\rho}\right] t\right) \quad (5)$$

که در آن:

μ ضریب تضعیف فوتون است. مقادیر ρ/μ در جداول منبع [2] کتاب نامه ارائه شده اند. در بسیاری از مسائل تجربی نتایج تضعیف فوتون بین نتایج معادله های (۳) و (۵) است.

۲-۴-۱-۶ می‌توان برای تعیین بزرگی تغییر به جای معادلات (۱) و (۳) از معادلات (۱) و (۵) استفاده کرد که معادله (۴) حاصل شود. این نتیجه تغییر در نسبت D_A/D_B محاسبه شده با معادله (۴) به فاکتور $F(E)$ مربوط است

$$F(E) = \frac{\exp\left(-\left[\frac{\mu_{en}^B(E)}{\rho_B}\right]t\right) \exp\left(-\left[\frac{\mu^A(E)}{\rho_A}\right]t\right)}{\exp\left(-\left[\frac{\mu^B(E)}{\rho_B}\right]t\right) \exp\left(-\left[\frac{\mu_{en}^A(E)}{\rho_A}\right]t\right)} \quad (6)$$

اگر در گستره انرژی مورد نظر، $F(E)$ با درصدی بزرگتر از خطای قابل قبول ڈسنجی از عدد یک، اختلاف داشته باشد، به کاربردن این استاندارد مناسب نخواهد بود. در این موارد محاسبات انتقال مناسب توصیه می‌شود (به زیربند ۱-۵ مراجعه شود).

۳-۴-۱-۶ بسته به هندسه پراکندگی، ممکن است دُر جذبی از آنچه با استفاده از μ یا μ_{en} محاسبه شده است متفاوت باشد. استفاده از μ_{en} در معادله (۳) روشی مناسب برای حصول این نتیجه است که مقدار احتمالی چقدر است، به گونه‌ای که می‌توان مؤلفه پراکندگی را به طور واقعی محاسبه کرد. برای توضیحات بیشتر و اثراهای مشابه به منبع [۱] کتابنامه مراجعه شود.

۷ درستی

۱-۷ درستی این استاندارد اساساً به درستی اطلاعات طیف انرژی ورودی بستگی دارد. به طور کلی، حتی تخمین ضعیفی از طیف نسبت به تخمین بر اساس فرض تک «انرژی مؤثر فوتون»، می‌تواند تخمین بهتری از دُر جذبی در مکان مشخص ارائه دهد. اگرچه کالت-۶۰ و سزیم ۱۳۷ انرژی‌های پرتو-گاما اولیه خوش‌تعییفی دارند، طیف انرژی پرتو بسیاری از چشمها شامل مؤلفه پراکنده کامپتون معنی‌داری هستند که در صورت نادیده گرفته شدن، می‌تواند منجر به خطاهای معنی‌دار شوند (به مدرک 18 ICRU مراجعه شود).

۲-۷ همان‌طور که در زیربند ۱-۳ بیان شده است، نتایج این استاندارد فقط در صورتی صحت دارد که در عمق موردنظر از ماده، تعادل ذره باردار برقرار باشد. برای عمق‌های کمتر از آنچه برای تعادل مورد نیاز است دُر جذبی می‌تواند کمتر یا بیشتر از آنچه که این روش پیش‌بینی می‌کند، باشد. در عمق‌های بیشتر از عمق موردنیاز برای تعادل، اساساً درستی نتایج به درستی تصحیح تضعیف به کاربرده شده در معادله (۳) و آگاهی از طیف انرژی ورودی بستگی دارد.

۳-۷ این روش از واگذاری محتمل نابهجهای انرژی توسط الکترون‌های ثانویه صرف‌نظر می‌کند اما تولید تابش ترمی توسط الکترون‌های ثانویه، آن را تصحیح می‌کند. برای گستره انرژی مشخص در این استاندارد، این ملاحظات در حدود ۵٪ یا کمتر در عدم قطعیت کل سهیم هستند.

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

عمق تعادل ذره باردار

الف-۱ هنگامی که ماده با پرتوهای گاما یا ایکس پرتودهی می‌شود، همان‌طور که پرتو در ماده نفوذ می‌کند، در ابتدا یک افزایش در جذب انرژی وجود دارد. پس از عمق محدودی، جذب انرژی پرتو به یک بیشینه می‌رسد و پس از آن کاهش می‌یابد. عمق لازم برای رسیدن به بیشینه جذب انرژی، عمق «تعادل ذره باردار» نامیده می‌شود که تابعی از انرژی پرتو و ضریب جذب انرژی جرمی ماده مورد پرتودهی است.

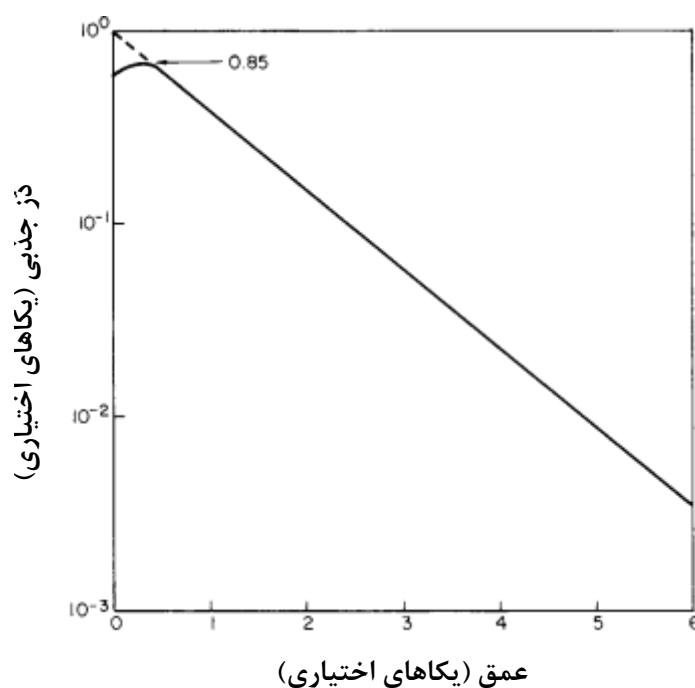
الف-۲ شکل الف-۱ نمونه‌ای از نمودار جذب انرژی به صورت تابعی از عمق در ماده است. δ جذبی $^{+/-} 85$ فقط به منظور نمایش استفاده شده است. هر چشم و ترکیب ماده جاذب، منحنی مشخصه خود را خواهد داشت. هرگاه آزمونه از تمام جهات پرتودهی شود، لازم است که آزمونه از تمام جهات با برقرارکننده تعادل^۱ احاطه شود تا اطمینان حاصل شود که در سراسر نمونه تعادل ذره باردار برقرار است. اگرچه، هنگامی که نمونه در بیش از یک جهت پرتودهی می‌شود، با قراردادن برقرارکننده تعادل در تماس با سطوح روبرو و پشت ماده، می‌توان به تعادل تقریبی ذره باردار در آن دست یافت. افزایش اولیه در شکل الف-۱ به طور متناوب دیده نمی‌شود. این موضوع به این دلیل است که الکترون‌ها از محیط در راستای فوتون‌های ورودی به هدف برخورد می‌کنند.

الف-۳ در برخی موارد، عمق تعادل باید برابر با برد تجربی، R_P ، برای الکترون‌های ثانویه دارای بیشینه انرژی، در نظر گرفته شود. برای آلومینیم، R_P بر حسب $g \cdot cm^{-2}$ می‌تواند از معادله (الف-۱) محاسبه شود (به مدرک 21 ICRU مراجعه شود):

$$R_P = 0,530E_0 - 0,0106 \quad (\text{الف-1})$$

که در آن:

E_0 انرژی الکترون‌های ثانویه دارای بیشینه انرژی تولیدشده از فوتون‌های چشمی بر حسب MeV، است. مقدار عمق تعادل به دست آمده از این روش بزرگتر از آنچه که در زیربندهای الف-۱ و الف-۲ توضیح داده شده است، می‌باشد (برای جزئیات بیشتر شرایط مناسب برای اعمال هر یک از دو روش، به پیوست X3 استاندارد ASTM E668 مراجعه شود).



شکل الف-۱- یک نمونه از دُر جذبی بر حسب عمق در ماده

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

نمونه محاسبه دُز جذبی برای طیف گستردۀ انرژی فوتون

ب-۱ برای نشان دادن این روش، یک نمونه محاسبه در این پیوست ارائه شده است. این محاسبه بر اساس فرض‌های زیر است:

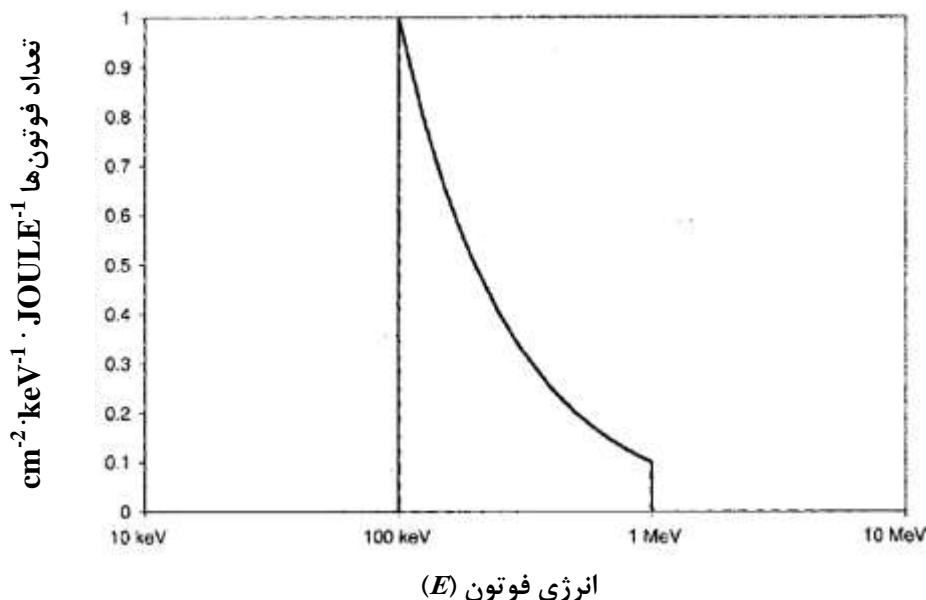
ب-۱-۱ یک دُزسنج سیلیکونی مناسب، خروجی ماشین پرتو ایکس را در یک مکان مشخص $15 \text{ Gy} (1.5 \times 10^3 \text{ rad})$ اندازه‌گیری کرده است.

یادآوری- یکای دُز جذبی در دستگاه بین‌المللی یکاهای (SI)، گُری است که با علامت Gy نشان داده می‌شود. یک گُری، برابر یک ژول بر کیلوگرم است. یکای سابق دُز جذبی راد می‌یاشد. هر گُری برابر ۱۰۰ راد است.

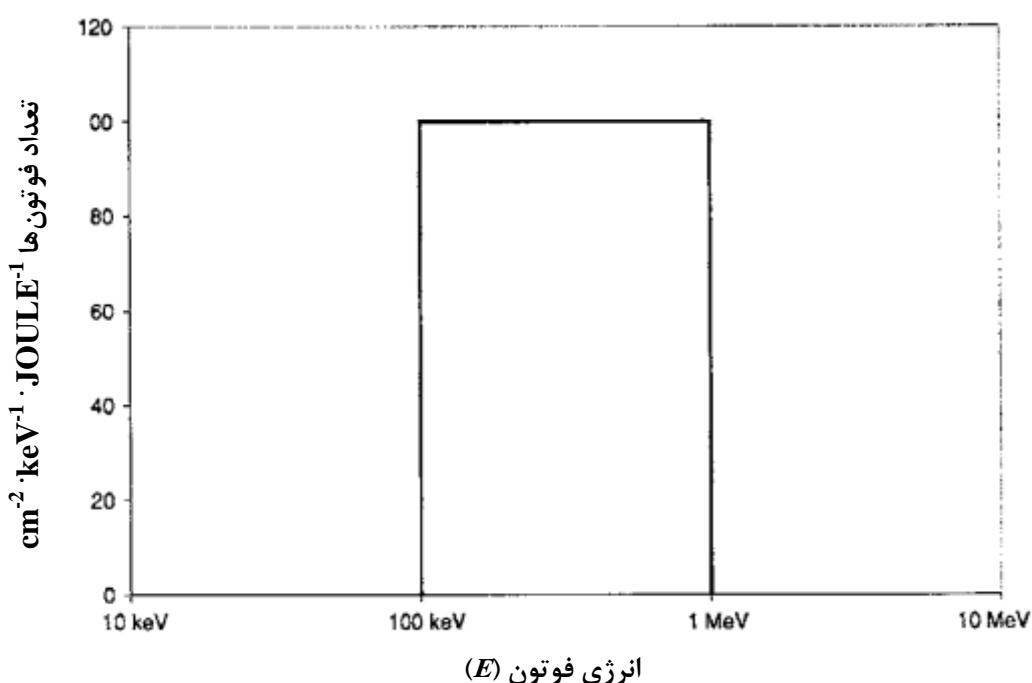
ب-۱-۲ طیف خروجی پرتو ایکس از ماشین همان‌طور که در شکل ب-۱ نشان داده شده است، به صورت $1/E$ از 100 keV تا 1 MeV تغییر می‌کند که E انرژی فوتون است. شارش خروجی فوتون از ماشین پرتو ایکس که در شکل ب-۱ نشان داده شده است، به انرژی فوتون بر حسب کیلو الکترون ولت در نقطه اندازه‌گیری و انرژی ورودی به ماشین بر حسب ژول، بهنجار شده است. بنابراین، یکاهای مقیاس قراردادی محور عمودی برابر تعداد فوتون‌ها در $\text{J}^{-1} \cdot \text{keV}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2}$ است.

ب-۲ از آن جایی که کمیت موردنظر دُز جذبی است، به جای شارش فوتون، شارش انرژی خروجی بهنجارشده لازم است. شارش انرژی بهنجارشده برای هر بازه انرژی می‌تواند از حاصل ضرب شارش فوتون بهنجارشده در شکل ب-۱ در مقدار مربوط به انرژی فوتون به ازای بازه انرژی به دست بیاید. نتایج در شکل ب-۲ نشان داده شده است که در آن شارش انرژی بهنجار شده مقداری ثابت برابر $100 \text{ keV} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{J}^{-1}$ بر روی تمام گستره انرژی دارد.

ب-۳ توجه داشته باشید در این نقطه دُزسنج بر حسب دُز جذبی در سیلیکون کالیبره شده است و حاوی لایه‌ای از ماده‌ای است که آن را در قله منحنی دُز جذبی بر حسب عمق قرار می‌دهد. نمونه‌ای از طیف توصیف شده، در شکل الف-۱ نشان داده شده است. اگرچه این منحنی، نمونه‌ای برای اندازه‌گیری است، همواره باید برای هر چشمۀ پرتودهی و شرایط مربوط به آن به صورت تجربی به دست بیاید.



شکل ب-۱- نمودار تعداد- طیف انرژی ناشی از پرتو ایکس ماشین فلاش^۱



شکل ب-۲- طیف شارش انرژی فرضی از پرتو ایکس ماشین فلاش

1- Flash machine

ب-۳-۱ شکل الف-۱، نشان می‌دهد که قله منحنی دُز جذبی سیلیکون بر حسب عمق،٪ دُز سطحی برون‌یابی شده برای طیف فرودی در شکل ب-۱ است. بنابراین دُز سطحی برون‌یابی شده در این مثال با تقسیم دُز جذبی اندازه‌گیری شده (۱۵ Gy) بر ۸۵ به دست می‌آید و برابر با ۱۷.۶ Gy است.

ب-۳-۲ بر طبق دُز تعریف شده در معادله (۱)، دُز سطحی محاسبه شده رابطه تابعی یکسانی با $\Psi(E)$ دارد. سایر پارامترها در آن معادله برای این مثال به این صورت فرض شده است که $\Psi(E)$ طیف شارش انرژی فرودی، $\mu_{en}(E)/\rho$ ضریب جذب انرژی جرمی برای سیلیکون و I ، ثابت بهنجارش است. حدّهای انرژی برای انتگرال همان‌طور که در شکل ب-۲ نشان داده شده، از ۰.۱ MeV تا ۱ MeV است. مقادیر ضرایب جذب انرژی جرمی، $\mu_{en}(E)/\rho$ ، برای بازه انرژی مورد استفاده، در جدول ب-۲ داده شده‌اند. مطابق با زیربند ب-۲، $\Psi(E)$ به انرژی ورودی ماشین، بهنجار شده است و یکای آن $\text{keV}^{-1} \cdot \text{J}^{-1}$ است.

جدول ب-۱- ارزیابی عددی انتگرال در معادله (ب-۱) برای نمودار تعداد- طیف انرژی نشان داده شده در شکل I
ب-۱ بهمنظور تعیین ثابت بهنجارش I

شارش انرژی نرمال $\text{keV} \cdot \text{J}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$	$\mu_{en}/\rho (\text{cm}^2 \cdot \text{g}^{-1})$	شارش انرژی در بازه‌های زمانی $\text{keV} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{J}^{-1}$	انرژی فوتون keV
2.29×10^{-2}	۰.۰۴۵۹	50×10^{-2}	۱۰۰
1.56×10^{-2}	۰.۰۳۱۲	50×10^{-2}	۱۵۰
2.93×10^{-2}	۰.۰۲۹۳	100×10^{-2}	۲۰۰
2.94×10^{-2}	۰.۰۲۹۴	100×10^{-2}	۳۰۰
2.98×10^{-2}	۰.۰۲۹۸	100×10^{-2}	۴۰۰
2.98×10^{-2}	۰.۰۲۹۸	100×10^{-2}	۵۰۰
5.90×10^{-2}	۰.۰۲۹۵	200×10^{-2}	۶۰۰
5.76×10^{-2}	۰.۰۲۸۸	200×10^{-2}	۸۰۰
27.34×10^{-2}			مجموع

ب-۳-۳ ثابت بهنجارش، I ، با استفاده از معادله (۱) به صورت معادله (ب-۱) به دست می‌آید:

$$I = \frac{D}{\int_{0.1 \text{ MeV}}^{1 \text{ MeV}} \Psi(E) [\mu_{en}(E)/\rho] dE}$$

$$= \frac{17.6}{27.34 \times 10^2} \quad (\text{ب-۱})$$

$$= 6.4 \times 10^{-3} \text{ Gy} \cdot \text{J} \cdot \text{g} \cdot \text{keV}^{-1}$$

که در آن:

D , دُز سطحی، و از محاسبات زیربند ب-۳-۱ به دست می‌آید و انتگرال با نتایج نشان داده شده از جدول ب-۱ به صورت عددی محاسبه می‌شود.

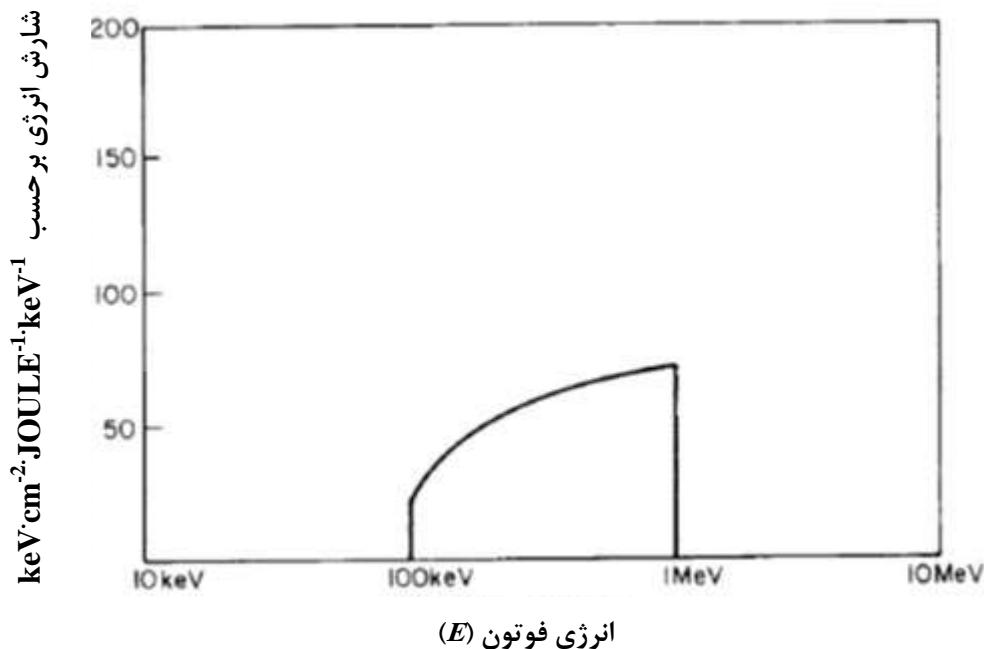
ب-۴ حال، در نظر بگیرید در این نمونه محاسبات چه مقدار دُز جذبی در چه عمقی از آزمونه آهن اتفاق می‌افتد. عمق مورد نظر $6/4 \text{ mm}$ (در حدود 0.25 in.) معادل با 5 g cm^{-2} است.

ب-۴-۱ برای انجام این محاسبات، از معادله (۱) استفاده می‌شود که در آن $(E)\psi$ طیف شارش انرژی در عمق 5 g cm^{-2} در آهن است و طیف فروودی در سطح نیست. طیف تضعیف شده مناسب با استفاده از معادله (۳) محاسبه می‌شود. مقادیر ضرایب جذب انرژی جرمی از منبع [۲] کتابنامه و طیف فروودی از شکل ب-۱ به دست می‌آیند. جزئیات این محاسبه در جدول ب-۲ همراه با نتیجه طیف شارش انرژی در شکل ب-۳ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود 5 g cm^{-2} از آهن، شکل طیف شارش انرژی را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌دهد.

جدول ب-۲- تبدیل طیف پرتوایکس فروودی نشان داده شده در شکل ب-۱ به طیف شارش- انرژی تضعیف شده نشان داده شده در شکل ب-۳

طیف شارش انرژی $\text{keV} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{keV}^{-1} \cdot \text{J}^{-1}$	طیف تضعیف شده $\text{cm}^{-2} \cdot \text{keV}^{-1} \cdot \text{J}^{-1}$	$\mu_{\text{en}}/\rho (\text{cm}^2 \cdot \text{g}^{-1})$	طیف ورودی $\text{cm}^{-2} \cdot \text{keV}^{-1} \cdot \text{J}^{-1}$	انرژی فوتون keV
۳۳	۰.۳۳	۰.۲۱۹	۱.۰	۱۰۰
۶۷	۰.۴۵	۰.۰۸۱۴	۰.۶۷	۱۵۰
۷۸	۰.۳۹	۰.۰۴۹۵	۰.۵۰	۲۰۰
۸۴	۰.۲۸	۰.۰۳۳۵	۰.۳۳	۳۰۰
۸۴	۰.۲۱	۰.۰۳۰۸	۰.۲۵	۴۰۰
۸۵	۰.۱۷	۰.۰۲۹۵	۰.۲۰	۵۰۰
۹۰	۰.۱۵	۰.۰۲۸۶	۰.۱۷	۶۰۰
۸۸	۰.۱۱	۰.۰۲۷۳	۰.۱۳	۸۰۰

ب-۴-۲ انتگرال معادله (۱) در زیربند ب-۳-۳، با استفاده از مقادیر $\mu_{\text{en}}(E)/\rho$ برای آهن (به منبع [۲] کتابنامه مراجعه شود) و طیف تضعیف شده از جدول ب-۲ محاسبه شده است. نتیجه در جدول ب-۳ آورده شده است.



شکل ب-۳- طیف شارش انرژی تضعیف شده حاصل در عمق $5 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-2}$ از آهن

جدول ب-۳- ارزیابی عددی انتگرال معادله ب-۱ برای طیف شارش- انرژی نشان داده شده در شکل ب-۳ برای تعیین دُز جذبی آهن در عمق $5 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-2}$

شارش انرژی نرمال $\text{keV} \cdot \text{J}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$	μ_{en}/ρ ($\text{cm}^2 \cdot \text{g}^{-1}$)	شارش انرژی در بازه های زمانی $\text{keV} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{J}^{-1}$	انرژی فوتون keV
$3,61 \times 10^{-2}$	۰,۷۲۱۹	$16,5 \times 10^{-2}$	۱۰۰
$2,69 \times 10^{-2}$	۰,۷۰۸۱۴	33×10^{-2}	۱۵۰
$3,86 \times 10^{-2}$	۰,۷۰۴۹۵	78×10^{-2}	۲۰۰
$2,81 \times 10^{-2}$	۰,۷۰۳۳۵	84×10^{-2}	۳۰۰
$2,59 \times 10^{-2}$	۰,۷۰۳۰۸	84×10^{-2}	۴۰۰
$2,51 \times 10^{-2}$	۰,۷۰۲۹۵	85×10^{-2}	۵۰۰
$5,15 \times 10^{-2}$	۰,۷۰۲۸۶	$18,0 \times 10^{-2}$	۶۰۰
$4,80 \times 10^{-2}$	۰,۷۰۲۷۳	176×10^{-2}	۸۰۰
$28,02 \times 10^{-2}$			مجموع

ب-۴-۳ دُز جذبی در این نمونه محاسبه برای آهن، حاصل ضرب نتیجه ارزیابی عددی انتگرال معادله (ب-۱) که در جدول ب-۳ ارائه شده است در فاکتور بهنجارش، I ، که در زیربند ب-۳-۳ به دست آمده است، به صورت زیر محاسبه می شود:

$$D = 6,4 \times 10^{-3} \times 28,02 \times 10^2 = 18 \text{ Gy(Fe)} = 1,8 \times 10^{-3} \text{ rad(Fe)} \quad (\text{ب-۲})$$

پیوست پ

(آگاهی دهنده)

یک نمونه محاسبه دُز جذبی برای طیف انرژی فوتون تقریباً تک انرژی

پ-۱ ایزوتوپ‌های پرتوزایی مانند سزیم-۱۳۷ و کبالت-۶۰، نمونه‌هایی از چشمه‌های با طیف فوتون تقریباً تک انرژی هستند. این نمونه محاسبات برای این قبیل چشمه‌های ایزوتوپی به کار می‌روند. فرض می‌شود فوتون‌های پراکنده شده از این‌گونه از چشمه‌ها، یک مؤلفه قابل صرفنظر از شارش فوتون فروودی است. در عمل، غالباً این فرض معتبر نیست، اما اگر طیف واقعی انرژی فوتون مشخص باشد، روش اجرایی محاسبات تشریح شده در پیوست ب قابل استفاده است.

پ-۲ برای مثال، فرض کنید سامانه پرتودهی با چشمہ کبالت-۶۰، آهنگ پرتوگیری، \dot{X} ، با مقدار $10^{1.5} \text{ Gy}$ رونتگن^۱ بر ساعت را در یک مکان مشخص ایجاد می‌کند. فرض می‌شود طیف انرژی فوتون فروودی در مکان مورد نظر، مؤلفه پراکنده‌گی قابل اغماضی داشته باشد.

پ-۲-۱ برای همان آزمونه آهن ذکر شده در پیوست ب، آهنگ دُز جذبی در عمق 5 cm^2 طبق معادله زیر به دست می‌آید:

$$D = 8,69 \times 10^{-3} \cdot \frac{(\mu_{\text{en}}/\rho)_{\text{Fe}}}{(\mu_{\text{en}}/\rho)_{\text{air}}} \cdot X \exp \left[- \left(\frac{\mu_{\text{en}}(E)/\rho}{\rho} \right)_{\text{Fe}} \cdot t \right] \quad (\text{پ-۱})$$

که مقدار $10^{1.5} \text{ Gy}$ رونتگن را به گری (در هوای ρ_{air}) تبدیل می‌کند؛ μ_{en}/ρ ضریب جذب انرژی جرمی برای انرژی‌های فوتون (میانگین $1,25 \text{ MeV}$) چشمہ کبالت-۶۰ است؛ \dot{X} آهنگ پرتوگیری و t عمق آهن است. (برای کسب جزئیات بیشتر در مورد محاسبات، به مدرک ICRU 80 مراجعه شود).

پ-۲-۲ نسبت ضرایب جذب انرژی جرمی آهن به هوای فقط از $0,942$ در 1 MeV تا $0,940$ در 2 MeV تغییر می‌کند. بنابراین، برای این محاسبه 1 MeV انتخاب شده است. با استفاده از معادله (پ-۱) نتیجه برای این مثال، به صورت زیر است:

$$D_{\text{Fe}} = 8,69 \times 10^{-3} \cdot 0,942 \cdot 1,5 \times 10^3 \cdot 0,886 = 11 \text{ Gy(Fe).h}^{-1} \\ = 1,1 \times 10^3 \text{ rad(Fe).h}^{-1} \quad (\text{پ-۲})$$

پیوست ت

(آگاهی دهنده)

تضعیف باریکه

ت-۱ معادله (۳) (به بند ۵ مراجعه شود) تقریب مناسبی برای محاسبه تضعیف طیف شارش انرژی در عمق جرمی t است. این پیوست، استنتاجی از معادله (۳) را فراهم می کند که تقریب های به کار رفته در آن به طور شفاف، ارائه شده است.

ت-۲ فرض های استفاده شده در این استنتاج به شرح زیر است:

ت-۲-۱ فرض می شود تعادل ذره باردار برقرار است. برای توضیح بیشتر به زیربند ۳-۱-۶ و پیوست الف مراجعه شود.

ت-۲-۲ فرض می شود هندسه باریکه، گسترده باشد. برای توضیح بیشتر به زیربند ۴-۱-۶ مراجعه شود.

ت-۲-۳ فرض می شود عمق جرمی t کوچک است. برای توضیح بیشتر به زیربند ت-۴-۵ مراجعه شود. توجه به این نکته نیز اهمیت دارد که برای استفاده از معادله (۶) نیز الزام استفاده از مقادیر کوچک t برقرار است.

ت-۲-۴ فرض می شود هندسه مسطح و یک بعدی است. این فرض با فرض هندسه باریکه گسترده سازگار است. برای توضیح بیشتر به زیربند ۴-۱-۶ مراجعه شود.

ت-۳ اگر طیف شارش انرژی (E) Ψ فروdi در صفحه باشد، در آن صورت (E) Ψ را می توان به صورت طیف شارش انرژی در عمق جرمی t تعریف کرد:

$$\Psi(t) = \int_0^{\infty} \Psi_t(E) dE \quad (\text{ت-۱})$$

به طوری که (t) Ψ شارش انرژی در عمق جرمی t است. به علاوه، انرژی واگذار شده در واحد سطح در یک صفحه بسیار کوچک با ضخامت جرمی dt به صورت زیر است:

$$-\frac{d\Psi(t)}{dt} \cdot dt \quad (\text{ت-۲})$$

ت-۴ معادله (۱) دُر جذبی را به صورت زیر تعریف کرده است:

$$D = \int_0^\infty \Psi_t(E) [\mu_{en}(E)/\rho] dE \quad (ت-۳)$$

و معادله (ت-۲) انرژی واگذار شده را بیان می‌کند، که به صورت زیر است:

$$\int_0^\infty \Psi_t(E) [\mu_{en}(E)/\rho] dE = \frac{d\Psi(t)}{dt} \quad (ت-۴)$$

ت-۵ سپس، حالت طیف فرودی، تکفام با انرژی E_0 در نظر گرفته خواهد شد. به علاوه فرض می‌شود که $\mu_{en}(E)$ در گستره مورد نظر انرژی فوتون خیلی تغییر نمی‌کند. برای شرح دقیق‌تر معادله، فرض می‌شود μ تفاوت ناچیزی با گستره‌های انرژی شامل انرژی فوتون‌های اولیه (فرودی) و انرژی اکثر فوتون‌های پراکنده شده تولید شده توسط باریکه اولیه را دارد. اگر باریکه اولیه از میان ضخامت جرمی به اندازه کافی کوچک عبور کند، این فرض قابل قبول است. به این معنی که اگر $(\mu_{en}(E)/\rho)$ به اندازه کافی کوچک باشد، تغییرات انرژی فوتون از انرژی فرودی E_0 نیز به اندازه کافی کوچک خواهد بود. با این فرض این تقریب برای خارج کردن ضریب جذب انرژی جرمی از انتگرال زیر، قابل قبول خواهد بود

$$[\mu_{en}(E_0)/\rho] \int_0^\infty \Psi_t(E) dE = - \frac{d\Psi(t)}{dt} \quad (ت-۵)$$

یا، با استفاده از معادله (ت-۱)

$$[\mu_{en}(E_0)/\rho] \Psi(t) = - \frac{d\Psi(t)}{dt} \quad (ت-۶)$$

که پاسخ آن به صورت زیر است:

$$\Psi(t) = \Psi(0) e^{-[\mu_{en}(E_0)/\rho]t} \quad (ت-۷)$$

که با استفاده از معادله (ت-۱) مانند معادله زیر است:

$$\int_0^\infty \Psi_t(E) dE = \Psi_0(E_0) e^{-[\mu_{en}(E_0)/\rho]t} \quad (ت-۸)$$

ت-۶ این محاسبه می‌تواند به باریکه فرودی چندفام تعمیم داده شود:

$$\int_0^\infty \Psi_t(E) dE = \int_0^\infty \Psi_0(E) e^{-[\mu_{en}(E_0)/\rho]t} dE \quad (ت-۹)$$

که معادله (۳) را نشان می‌دهد.

پیوست ث

(آگاهی دهنده)

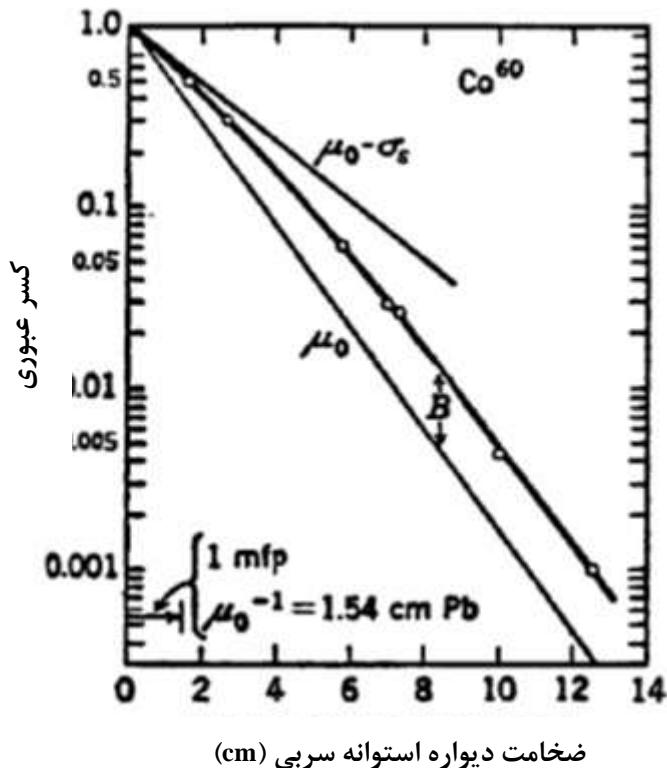
توجیه تجربی معادله (۳)

ث-۱ در منبع [۵] کتابنامه، عبور پرتوهای گامای کمالت-۶۰ از میان حفاظهای سربی استوانهای نشان داده شده است (به شکل ث-۱ مراجعه شود). منحنی میانی در شکل، داده‌های تجربی را نشان می‌دهد و عبور تمام فوتون‌ها (فوتون‌های اولیه و پراکنده شده) را به صورت تابعی از ضخامت دیواره ارائه می‌دهد.

ث-۲ اولین تقریب عبور فوتون در منحنی پایینی شکل ث-۱ نشان داده شده است. این منحنی عبور محاسبه شده پرتوهای گامای اولیه (غیرپراکنده) را ارائه می‌دهد. به این معنی که فرض می‌شود پرتو پراکنده کامپتون از باریکه عبوری حذف شده است. این عبور محاسبه شده در منحنی نیمه‌لگاریتمی به شکل خط راست با شیب ضریب تضعیف کل، $\mu_{\text{en}} = 0.5$ ، است.

ث-۳ دومین تقریب عبور فوتون در منحنی بالایی شکل ث-۱ نشان داده شده است. برای مقادیر کم ضخامت دیواره، عبور به عنوان تابعی از ضخامت می‌تواند با یک خط راست با شیب برابر با $\mu_{\text{en}} = 0.5$ تقریب زده شود. توجه شود که این خط راست تقریب خوبی برای داده تجربی به ازای ضخامت‌های کمتر از یک پویش آزاد میانگین^۱ ($mfp = 1$) است. با استفاده از بند اصطلاحات و تعاریف این استاندارد، $\mu_{\text{en}} = 0.5$ برابر ضریب جذب انرژی μ_{en} است. توجه کنید که استفاده از خط راست بر این فرض دلالت دارد که μ_{en} به عنوان تابعی از ضخامت به طور معنی‌داری تغییر نمی‌کند. برای توضیحات بیشتر به زیربند ت-۵ مراجعه شود.

ث-۴ مثال تجربی شکل ث-۱ برای حالت حفاظ سربی است. این مثال بهتر است به بدترین حالت نزدیک باشد که در آن سرب سطح مقطع برخورد نسبتاً بالایی برای پراکنده‌گی کامپتون دارد. بنابراین معادله (۳) برای مقادیر به اندازه کافی کوچک عمق جرمی t قابل استفاده است.



شکل ث-۱- عبور پرتوهای گاما کبالت-۶۰ از میان حفاظ استوانه‌ای سربی. خطوط تئوری برای عبور فوتون‌های اولیه، μ_0 و جذب واقعی انرژی اولیه، $\mu_0 - \sigma_s$ ، به منظور مقایسه نشان داده شده‌اند (به منبع [5] کتاب‌نامه مراجعه شود)

پیوست ج

(آگاهی دهنده)

محاسبه دُز

ج-۱ این پیوست استخراج دُز از معادله (۴) را ارائه می‌دهد (به بند ۶ مراجعه شود). این استخراج نتایج پیوست ت را مورد استفاده قرار می‌دهد.

ج-۲ جایگزین کردن معادله (ت-۱) در معادله (ت-۴) نتیجه می‌دهد:

$$\int_0^{\infty} \psi_t(E) [\mu_{\text{en}}(E)/\rho] dE = - \frac{d}{dt} \int_0^{\infty} \psi_t(E) dE \quad (\text{ج-۱})$$

جایگزینی معادله (۱) و (۳) می‌دهد:

$$D = \int_0^{\infty} \psi_t(E) [\mu_{\text{en}}(E)/\rho] dE = - \frac{d}{dt} \int_0^{\infty} \psi_0(E) e^{-[\mu_{\text{en}}(E_0)/\rho]t} dE \quad (\text{ج-۲})$$

یا

$$D = \int_0^{\infty} \psi_0(E) e^{-[\mu_{\text{en}}(E)/\rho]t} [\mu_{\text{en}}(E)/\rho] dE \quad (\text{ج-۳})$$

این معادله به ما اجازه می‌دهد معادله (۴) را استخراج کنیم.

کتاب‌نامه

- [1] Attix, F. H., *Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry*, John Wiley and Sons, 1986.
- [2] Hubbel, J. H., and Seltzer, S. M., "Table of X-Ray Mass Attenuation Coefficients and Mass Energy-Absorption Coefficients 1 keV to 20 MeV for Elements Z = 1 to 92 and 48 Additional Substances of Dosimetric Interest," National Institute of Standards and Technology *Report NISTIR 5632*, May 1995. For latest update see <http://physics.Nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/cover.html>.
- [3] Hubbel, J. H. and Berger, M. J., "Attenuation Coefficients, Energy Absorption Coefficients, and Related Quantities," *Engineering Compendium on Radiation Shielding*, Vol 1, Chapter 5.1, Springer-Verlag, New York, N.Y., 1968.
- [4] Chilton, A. B., "Broad Beam Attenuation," *Engineering Compendium on Radiation Shielding*, Vol 1, Chapter 5.3, Springer-Verlag, New York, N.Y., 1968.
- [5] Evans, R. D., *The Atomic Nucleus*, (McGraw Hill Book Co., Inc., New York, 1955), p. 732.